CQ-X5 (FN) Толщина покрытия (датчик) использует технологию измерения двойного назначения, магнитная и вихретоковый метод измерения толщины может автоматически определить магнитные и немагнитных подложки, а затем использовать соответствующие методы испытаний, неразрушающего измерения на Немагнитная толщина покрытия из магнитных металлических субстратов (таких как сталь, железо, сплава и твердой магнитной стали и т.д.) (например, алюминий, хром, медь, эмаль, каучук, краски и т.п.) и немагнитного металлические подложки (такие как медь, алюминий, непроводящей толщины покрытия (например,) на цинк, олово: эмали, резины, краски, пластмассы и т.д.).

Толщина покрытия имеет погрешность измерения мала, высокая надежность, хорошая устойчивость, простота в эксплуатации, имеет важное значение для обеспечения контроля качества и методы испытаний продукции, широко используемых в производстве, металлообрабатывающей промышленности, химической промышленности, обнаружение товар осмотр. Продукт прошел Национальный центр для дозирования Южный Китай, Китай институт метрологии, Гуандун проверке, и выдавать соответствующие сертификаты, крупных производителей всех возрастов.

ассортимент:

CQ-X5 (FN) алюминида железа покрытия толщиной от толщины подложки может двойного измерения включает тефлон на алюминиевой или медной подложкой, эмали, эмали, эпоксидные, или анодного измерения толщины оксидного покрытия. Методы испытаний для толщины покрытия индукционных магнитных приложений включают в себя цинк, кадмий, краски или порошковые покрытия.